

筑波大学プラズマ研究センター 米田 良隆

<u>Outline</u>

1.研究の背景と目的
2.実験装置の概要
3.ペレット入射結果
4.考察および今後の課題

## 1.研究の背景と目的

### <u>研究の背景</u>



### <u>本研究の目的</u>

安定した粒子補給のための、ペレット入射装置の制御

# 2.タンデムミラー装置GAMMA10



GAMMA10下方から垂直方向ヘペレット入射

2.ペレット入射実験装置



## 2.ペレット入射実験装置





### 2.ペレット入射実験装置

### ライトゲートシステム(以下、LGと略す)

- ・2本の対向して設置された光ファイバー(片方から光を当てる)
- ・ペレットが通過し、光が遮られることを検出
- ・2つのLG間の距離と通過時間から、速度を算出できる
- ・ペレット形状撮影(シャドウグラフ)のトリガとしても用いる
- ・第一計測部にLG1、第二計測部にLG2、第三計測部にLG3,LG4 を設置している

### <u>シャドウグラフ</u>

- ・CCDカメラによるペレット形状撮影
- ・照明に色素レーザーを用いる
- ・第一計測部および第三計測部に設置している



## 2.Hα線検出器(縦横各12ch)



## 2.高速カメラ



を使用した

高速カメラを用いた計測は 広島大学 西野信博 准教授 との双方向共同研究

3.ペレット射出結果(速度)

#### ライトゲートシステム(以下LGと略す)による計測結果



3.ペレット射出結果(形状、粒子量)

シャドウグラフのペレット画像から予想される粒子数を算出する

ペレット画像(シャドウグラフ) #207703



Φ=0.50[mm]、L=1.3[mm]

 $n = \rho V = 2.6 \times 10^{28} [m^{-3}] \times \frac{0.50}{2} \pi \times 1.3 \times 10^{-9} [m^{3}]$  $= 0.66 \times 10^{19}$  [particles]

ここから予測される電子線密度上昇値は 36.67[10<sup>13</sup> / cm<sup>2</sup>]

他ショットのペレットの大きさは、 $\Phi = 0.50 \sim 0.60$ [mm]、L = 1.2~1.4[mm]



## 3.ペレット進入長(Ηα線検出器)



# 3.ペレット進入長(高速カメラ) 1/3

#### 高速カメラを用い、ペレット溶発を計測

#207714 (pellet only)





# 3.ペレット進入長(高速カメラ) 2/3

#### 高速カメラを用い、ペレット溶発を計測

#207703 (pellet with C-ECRH)



高速カメラを用いてC-ECRH印加時のペレット入射を計測 C-ECRH印加時では高温電子により、中心より下方で溶発

# 3.ペレット進入長(高速カメラ) 3/3

高速カメラを用い、ペレット溶発を計測

#207712 (pellet with C-NBI)



高速カメラを用いてC-NBI時のペレット入射を計測 C-NBIにより密度、温度が上昇し、中心近傍で溶発 C-ECRH印加時より、若干上方で溶発

3.ペレットのガイドチューブ内破損

#### 高速カメラを用いた計測により、ペレットの破損、分裂を確認

#207703 (pellet with C-ECRH)



高速カメラの画像より、ペレットが数個の小片になって 入射していることを改めて確認 (以前にもHα線放射輝度などから破損を確認していた)

# 3.ペレット進入速度(高速カメラ)

高速カメラを用い、ペレット進入速度を計測

#207703 (pellet with C-ECRH)



リミター半径(18cm)と 画像の溶発ペレット中心位置から ペレットの速度を算出





#### 粒子のY軸方向(径方向)、Z軸方向伝播について計測

径方向(Y軸方向) Hα線検出器



#### Z軸方向 高速カメラ



Hα線および高速カメラ画像から、Y軸、Z軸方向には突出した偏りはない

# 3.Y軸方向への拡散(Hα線検出器)



全体的にY軸マイナス方向(GAMMA10南側)の放射輝度が高い ガイドチューブからの射出方向が傾いている可能性あり

4.まとめ

### 1. ペレット入射装置の制御

同一条件で生成・射出した場合、安定したペレット射出を行えた

### <u>2. ペレット溶発位置</u>

・ペレットのみではプラズマを突き抜けたことを再確認

・C-ECRH印加時には中心より下方で溶発したことを再確認

・今回新たにC-NBI時にペレットを入射し、中心より下方で溶発することを確認

### <u>3. ペレット破損確認</u>

高速カメラにより、GAMMA10本体までの間にペレットが破損していることを確認

### <u>4. Y軸方向への拡散</u>

Y軸マイナス方向のH $\alpha$ 線放射輝度が高いことを確認

4.結果

### <u>1. ペレット溶発</u>

- ・ペレットのみでは十分に溶発しきれず、プラズマを突き抜ける
- ・C-ECRH印加時には電子温度が上がり、溶発が促進される(下方で溶発)

・C-NBI時にはイオン等の効果による溶発が促進される

### <u>2. ペレット破損</u>

 ・速度700[m/s]でのペレット射出では、輸送経路でペレットが破損する (破損率 93.2%、2~11個の破片に分裂する)
・輸送経路で減速があり、プラズマ中での速度は700[m/s]弱となる

### <u>3. Y軸方向への拡散</u>

・Hα線放射輝度より、Y軸マイナス側への傾いた射出を行っている可能性あり

## 4.今後の課題(理論モデル)

研究目的である、ペレット溶発過程および粒子・エネルギーの 伝搬解析のため、ペレット溶発モデルを理解する必要がある

### NGS(中性粒子遮蔽)モデル

ペレットから溶発(アブレーション)した水 素分子がペレット周囲に低温・高密度の 溶発雲を形成する。 プラズマからのエネルギー流束は、この 雲の中性粒子との弾性、非弾性散乱により減衰する。

入射するエネルギー流束において、 T<sub>e</sub> = T<sub>i</sub> の場合、(m<sub>e</sub>/m<sub>i</sub>)<sup>1/2</sup>で イオンの影響は無視できる。 →溶発は電子温度に大きく影響される →GAMMA10ではT<sub>e</sub> < T<sub>i</sub> よりイオンの 影響も考慮





### <u>1. NGSモデルの理解と応用</u>

- ・NGSモデルを理解し、電子温度の変化とペレット溶発について シミュレーションなどを行う。
- ・GAMMA10では、Ti > Teであるため、イオンの影響を考慮
- ・パラメータ(密度、温度など)を変化させてシミュレーションを行い、 実験結果と比較

### <u>2. ペレット射出環境の確認</u>







※テータ提供: NBIグルーフ 双方向共同研究 広島大学 西野信博 准教授 高速カメラを用いた計測データ より